＝RFID技術試験事務＝

920MHz帯及び950MHz帯電子タグシステムの周波数有効利用方策に関する調査検討

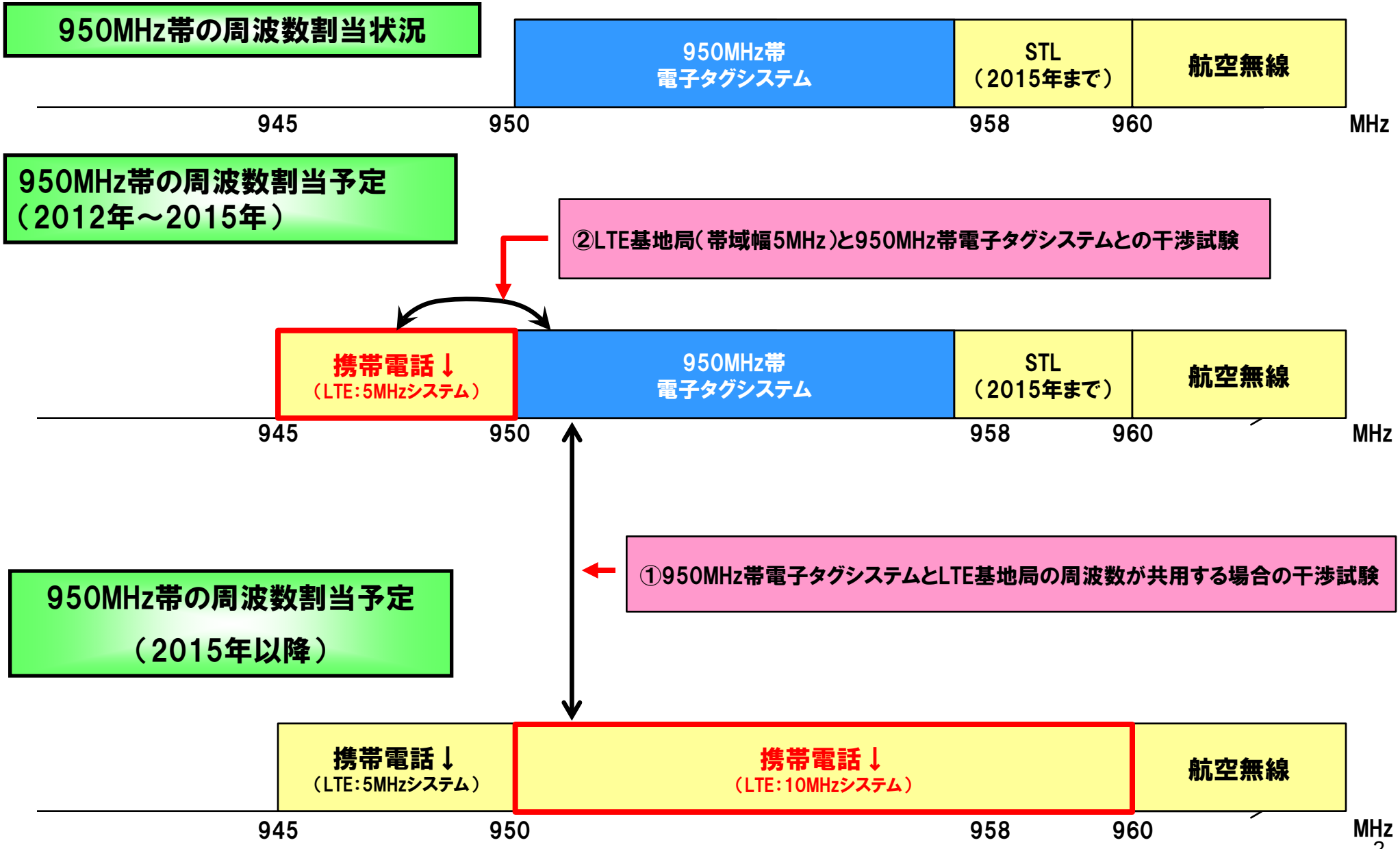
ご説明資料

2011年6月22日

パナソニック システムソリューションズ　ジャパン株式会社

技術試験の概要（950MHz帯技術試験）

（１）950MHz帯（950-958MHz）における検討



技術試験の概要（920MHz帯技術試験）

（２）920MHz帯（915-929.7MHz）における検討

920MHz帯の周波数割当状況

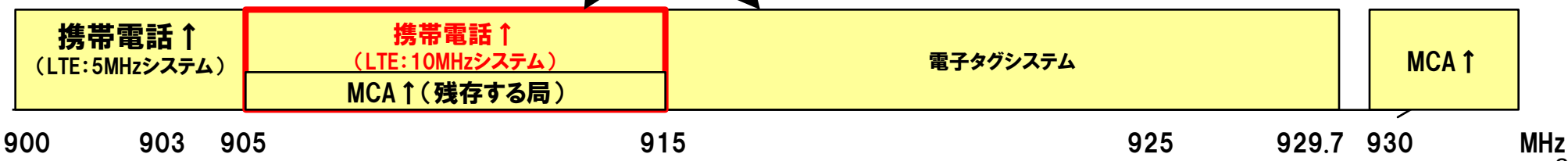
920MHz帯の周波数割当予定（2012年～2015年）

③MCA上り（残存する局：905-915MHz）と920MHz帯電子タグシステムとの干渉試験

②MCA上り（930-940MHz）と920MHz帯電子タグシステムとの干渉試験

920MHz帯の周波数割当予定（2015年以降）

①LTE上り（900-915MHz）と920MHz帯電子タグシステムとの干渉試験



進め方

【調査検討会の設置】

学識経験者、通信事業者、機器製造者、システム利用者等で構成する調査検討会を設置し、調査検討の進め方（測定方法・項目含む）及び課題抽出等について助言を得ながら進めてまいります。

【スケジュール （暫定）】

第1回 調査検討会（7月上旬）

検討内容（検討会の進め方、評価検証内容、測定方法、スケジュール等）の確認

第2回 調査検討会（7月下旬）

○ 950MHz帯（950-958MHz）における検討
- LTE基地局（帯域幅10MHz）と950MHz帯電子タグシステム（低出力パッシブ及びアクティブタグ）との干渉試験結果に基づく検討

○ 920MHz帯（915-929.7MHz）における検討
- LTE上り（900-915MHz）と920MHz帯電子タグシステムとの干渉試験結果に基づく検討

第3回 調査検討会（11月）

○ 950MHz帯（950-958MHz）における検討
- LTE基地局（帯域幅5MHz）と950MHz帯電子タグシステムとの干渉試験結果に基づく検討

○ 920MHz帯（915-929.7MHz）における検討
- MCA上り（930-940MHz）と920MHz帯電子タグシステムとの干渉試験結果に基づく検討
- MCA上り（残存する局）（905-915MHz）と920MHz帯電子タグシステムとの干渉試験結果に基づく検討

第4回 調査検討会（2月）

検討の結果をとりまとめた調査報告書（案）に基づく検討